

Измерение толщины стенок изделий из углеродных композиционных материалов с использованием вихретокового фазового метода

А. И. Потапов, В. А. Сясько

В статье рассмотрены принципы построения преобразователей для измерения толщины стенок изделий из углеродных композиционных материалов, вопросы расчета и оптимизации их характеристик, а также подавления мешающих параметров. Приведены конструкция и основные метрологические характеристики разработанных преобразователей.

Углеродные композиционные материалы (УКМ) широко применяются в различных отраслях промышленности, в том числе в авиакосмическом комплексе. Изделия из них могут быть как малоразмерными, так и крупногабаритными, площадью до десятков м², в том числе с шероховатой поверхностью. Диапазон толщин стенок несущих конструкций из УКМ в большинстве случаев составляет от 2 до 10 мм [1, 2]. Обеспечение заданной толщины стенки в процессе формования изделия является одной из гарантий требуемых прочностных характеристик изделий.

Чаще всего при контроле затруднен двусторонний доступ к стенке изделия, что серьезно ограничивает применение механических средств измерения толщины, а использование акустического эхо-метода не обеспечивает достоверности измерений из-за многократных отражений звуковых волн в слоистой структуре, значительного разброса скорости ультразвука по объему и площади изделия, а также шероховатости поверхности.

Сотрудники
Федерального
государственного
бюджетного обра-
зовательного уч-
реждения высшего
профессиональ-
ного образования
«Национальный
минерально-сырь-
евой университет
«Горный», кафедра
«Приборостроение»



**Потапов
Анатолий
Иванович**
Заведующий,
профессор, д. т. н.



**Сясько
Владимир
Александрович**
Профессор, д. т. н.

В связи с этим представляет интерес использование вихретокового метода неразрушающего контроля. При этом объект контроля следует рассматривать как многослойную электропроводящую неферромагнитную пластину толщиной T и электропроводностью σ_i каждого слоя. Можно говорить о некотором интегральном значении электропроводности $\sigma_{\text{и}}$ объекта контроля в объеме распространения вихревых токов. Для большинства изделий из УКМ $\sigma_{\text{и}}$ лежит в диапазоне $\approx 5 \div 40$ кСм/м и может сильно варьироваться (до $\pm 10 \div 15\%$) в одном изделии.

Вихретоковый фазовый метод измерения толщины электропроводящих материалов основан на анализе электромагнитного поля вихревых токов, наводимых в контролируемом объекте, зависящих от T , $\sigma_{\text{и}}$ и геометрических характеристик материала (диаметра d , шероховатости R_z и др.), а также величины зазора h между изделием и контактной поверхностью преобразователя. Структурная схема трансформаторного трехобмоточного вихретокового фазового преобразователя, использующего в качестве опорного сигнала напряжение на компенсационной обмотке, изображена на рис. 1.

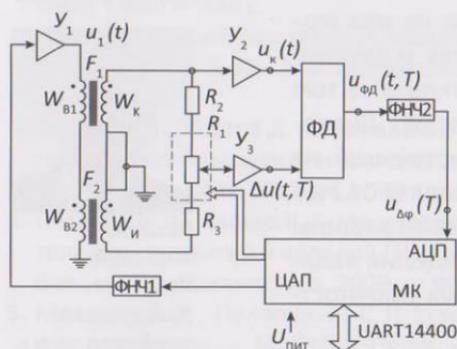


Рис. 1. Структурная схема вихретокового фазового преобразователя: $U_1 - U_3$ — усилители, ФД — фазовый детектор, ФНЧ1 — ФНЧ2 — фильтры низкой частоты, W_{B1} , W_{B2} — обмотки возбуждения, W_K и W_I — дифференциально включенные компенсационная и измерительная обмотки, МК — микроконтроллер, R_1 — управляемый цифровой балансировочный потенциометр, F_1 , F_2 — ферритовые броневые сердечники

Обмотка W_{B1} запитывается синусоидальным напряжением $u_1(t)$ частоты f . Усиленное разностное (вносимое) напряжение $\Delta u(t, T)$ поступает на фазовый детектор ФД. Опорным сигналом для фазового детектора служит напряжение $u_k(t)$ с выхода компенсационной обмотки W_K . Постоянное напряжение $U_{\text{Дп}}$ на выходе фильтра низкой частоты пропорционально разности фаз D_j между напряжением $u_k(t)$ и разностным (вносимым) напряжением $\Delta u(t, T)$. Балансировка обмоток преобразователя производится с использованием цифрового потенциометра, управляемого микроконтроллером.

Для анализа характеристик измерительного преобразователя удобно использовать обобщенный параметр

$$\beta = R\sqrt{2\pi f\sigma_{\text{и}}\mu_0}, \quad (1)$$

где R — эквивалентный радиус обмотки возбуждения;
 f — частота тока возбуждения;
 $\sigma_{\text{и}}$ — интегральная электропроводность материала;
 μ_0 — магнитная постоянная.

При выборе соответствующего значения f вариация T будет приводить к изменению $\Delta\varphi$. Однако девиация электропроводности материала изделия также будет приводить к изменению $\Delta\varphi$ и вызывать дополнительную погрешность $\Delta T(\sigma)$, для подавления которой следует определять истинное значение $\sigma_{\text{и}}$ в точке изменения.

Для обеспечения приемлемой чувствительности при измерении T величину β_T следует выбирать на уровне $0,5 \div 2$, а при измерении σ величину β_{σ} следует выбирать на уровне $5 \div 20$ [3].

В общем случае глубина проникновения вихревых токов δ , определяющая максимальную измеряемую толщину T_{max} и минимальную допустимую толщину при измерении электропроводности T_{min} , равна [4]:

$$\delta = 1/\sqrt{\pi f\sigma_{\text{и}}\mu_0}, \quad (2)$$

Проведенные исследования показали, что слои углеродных композиционных материалов могут отличаться по электропроводности, следовательно глубина проникновения вихревых токов должна обеспечивать интегральную оценку их свойств при измерении $\sigma_{\text{и}}$.

В соответствии с [3] допустимыми для рассматриваемой задачи являются $T_{\text{max}} \approx 0,7\delta$, а $T_{\text{min}} \approx 1,7\delta$.

Из указанных выше соотношений и (2) следует, что оптимальные значения частоты преобразователей для измерения толщины и электропроводности равны:

$$f_{T_{\text{опт}}} \approx 0,49 / (\pi\mu_0\sigma T_{\text{max}}^2), \quad (3)$$

$$f_{\sigma_{\text{опт}}} \approx 2,89 / (\pi\mu_0\sigma T_{\text{min}}^2) \quad (4)$$

соответственно.

Для обеспечения указанных выше значений β_T и β_{σ} эквивалентный радиус R обмотки W_1 для вихретоковых фазовых преобразователей необходимо выбирать из условия:

$$R = \beta/\sqrt{2\pi f\sigma_{\text{и}}\mu_0}. \quad (5)$$

При анализе характеристик преобразователей следует учесть влияние мешающих параметров:

- величины и вариации $\sigma_{и}$ изделия;
- зазора h между преобразователем и изделием;
- диаметра d изделия в зоне измерения и его вариации;
- шероховатости R_z изделия.

Измерение электропроводности изделий из УКМ проводилось на образцах продукции в соответствии с методикой, изложенной в [5]. Проведенные исследования изделий с отличающимися схемами армирования и различными соотношениями армирующего материала и связующего показали, что применительно к задачам измерения толщины стенки можно говорить о следующем диапазоне интегральной электропроводности $\sigma_{и} \approx 7 \div 35$ кСм/м. При этом граничные значения $T \approx 2 \div 10$ мм.

Для изделий с интегральной электропроводностью $\sigma_{и} = 35$ кСм/м оптимальные частоты для граничных значений T составят $f_{\text{Топт}} (T = 10) \approx 35$ кГц и $f_{\text{Топт}} (T = 2) \approx 875$ кГц. Соответственно, оптимальные частоты для измерения электропроводности $f_{\sigma_{\text{опт}}} (T = 10) \approx 200$ кГц и $f_{\sigma_{\text{опт}}} (T = 2) \approx 5$ МГц. Для изделий с интегральной электропроводностью $\sigma_{и} = 7$ кСм/м $f_{\sigma_{\text{опт}}} (T = 10) = 176$ кГц и $f_{\sigma_{\text{опт}}} (T = 2) = 4,4$ МГц, $f_{\sigma_{\text{опт}}} (T = 10) \approx 1$ МГц и $f_{\sigma_{\text{опт}}} (T = 2) \approx 25$ МГц. Для сердечников броневго типа с радиусом экрана $R = 6 \dots 15$ мм при рассчитанных значениях частот $\beta_T \approx 0,6$, $\beta_\sigma \approx 7$, что, в принципе, удовлетворяет условиям обеспечения оптимальной чувствительности. Однако приведенная на рис. 1 схема обеспечивает верхний диапазон рабочих частот на уровне ≈ 5 МГц, что соответствует $T_{\text{мин}} \approx 5$ мм при $\sigma_{и} = 7$ кСм/м. То есть измерение электропроводности во всем диапазоне контролируемых T и $\sigma_{и}$ не будет обеспечено. В этом случае при $T < 5$ мм для измерения $\sigma_{и}$ возможно применение вихретокового частотного метода [6] с учетом того, что он не обеспечивает отстройки от h и R_z .

Напряжение на измерительной обмотке $W_{и}$ равно сумме напряжения \dot{U}_0 , возникающего в отсутствие контролируемого изделия, и вносимого (разностного) напряжения $\dot{U}_{\text{вн}}$, возникающего вследствие влияния изделия с покрытием: $\dot{U} = \dot{U}_0 + \dot{U}_{\text{вн}}$.

Комплексное относительное вносимое напряжение $\dot{U}_{\text{вн}}^*$ в соответствии с [3] равно:

$$\dot{U}_{\text{вн}}^* = \frac{\dot{U}_{\text{вн}}}{|\dot{U}_0|} = \frac{j\pi c_0 R_B R_{и}}{M} \int_0^\infty J_1(\lambda R_B) J_1(\lambda R_{и}) e^{-\lambda|z_0 + z_{и}|} \chi_0 d\lambda,$$

$$\chi_0 = \frac{(\lambda - q_1)(q_1 + q_2)e^{Tq_1} - (\lambda + q_1)(q_2 - q_1)e^{-Tq_1}}{(\lambda + q_1)(q_1 + q_2)e^{Tq_1} - (\lambda - q_1)(q_2 - q_1)e^{-Tq_1}}, \quad (6)$$

$$q_i = \sqrt{\lambda^2 + j\mu_0\sigma_i\omega},$$

где T — толщина материала; R_B — радиус обмотки возбуждения; $R_{и}$ — радиус измерительной обмотки; $z_{и}$, z_B — расстояние от измерительной обмотки и обмотки возбуждения до поверхности изделия, соответственно; $J_1(\lambda R_i)$ — функция Бесселя первого порядка; λ — параметр преобразования; σ_i — электропроводность материала; M — коэффициент начальной взаимной индукции между обмотками; $\omega = 2\pi f$ — круговая частота тока возбуждения.

При расчетах можно принять радиусы обмоток равными радиусу ферритового броневого сердечника [4].

Разность фаз $\Delta\varphi$ определяется выражением:

$$\varphi = \arctg \frac{\text{Im}[\dot{U}_{BH}^*]}{\text{Re}[\dot{U}_{BH}^*]}. \quad (6)$$

На рис. 2 представлена рассчитанная в соответствии с (6) зависимость комплексного относительного вносимого напряжения \dot{U}_{BH}^* от толщины изделия для $\sigma_{и} = 35$ кСм/м при $f = 35$ кГц и $R \approx 15$ мм (кривая 1). Во всем диапазоне изменения T от 2 до 10 мм обеспечивается приемлемая чувствительность, позволяющая с учетом погрешности измерения разности фаз схемы $\Delta\varphi$ обеспечить абсолютную погрешность измерения на уровне $\pm 0,01T$ в нормальных условиях. Однако изменение указанных выше мешающих параметров будет вызывать дополнительную погрешность измерения.

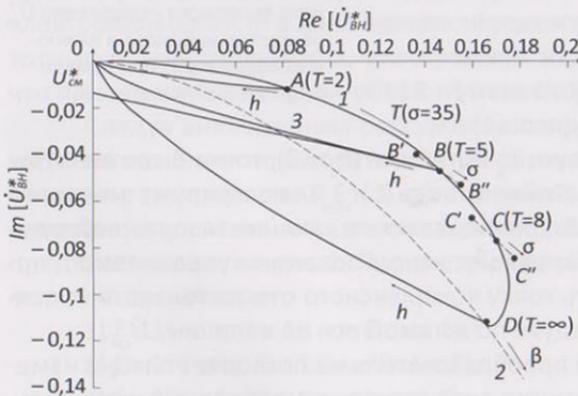


Рис. 2. Зависимость комплексного вносимого напряжения \dot{U}_{BH}^* от контролируемого и влияющих параметров при измерениях толщины изделия

сти измерения разности фаз схемы $\Delta\varphi$ обеспечить абсолютную погрешность измерения на уровне $\pm 0,01T$ в нормальных условиях. Однако изменение указанных выше мешающих параметров будет вызывать дополнительную погрешность измерения.

Линия отвода 3 иллюстрирует

влияние h в точке измерения B . Изменение зазора до $0,3$ мм вызовет дополнительную погрешность измерения порядка $0,1T$. Для подавления влияния зазора (а также эквивалентных зазору R_z и d) необходимо электронной балансировкой с использованием управляемого потенциометра R_1 сместить точку комплексного относительного вносимого напряжения на воздухе по мнимой оси на величину \dot{U}_{cm}^* , соответствующую диапазону измерения T .

Влияние вариации электропроводности изделия иллюстрируют линии $B'-B''$ и $C'-C''$, соответствующие изменению $\sigma_{и}$ от 32 до 38 кСм/м ($\pm 10\%$ от номинального значения), и показывающие, что дополнительная погрешность измерения может достигать величины $\pm(0,1 \dots 0,15) T$, в зависимости от диапазона измерения. Контроль $\sigma_{и}$ может позволить подавить влияние девиации $\sigma_{и}$ на результат измерения T .

Для других значений $\sigma_{и}$ годографы $\dot{U}_{вн}^*$ (T) носят аналогичный характер (например, при $\sigma_{и} = 7$ кСм/м для получения аналогичных зависимостей измерения необходимо проводить при $f \approx 176$ кГц и $R \approx 15$ мм).

Зависимость $\dot{U}_{вн}^*$ для задачи определения электропроводности применительно к преобразователю с $R = 6$ мм и $f \approx 5$ МГц представлена на рис. 3 (кривая 1).

Точка A соответствует $\sigma_{и} = 7$ кСм/м ($b_{\sigma} \approx 3$), точка B соответствует $\sigma_{и} = 35$ кСм/м ($b_{\sigma} \approx 7$). Линии отвода 2 и 3 иллюстрируют влияние h в точках измерения A и B . Для подавления влияния зазора необходимо электронной балансировкой с использованием управляемого потенциометра R_1 сместить точку комплексного относительного вносимого напряжения на воздухе по мнимой оси на величину \dot{U}_{cm}^* .

Рассматриваемый преобразователь не позволяет плавно изменять частоту возбуждающего тока, поэтому необходимо оптимальным образом подобрать частоты нескольких преобразователей для перекрытия диапазонов измерения T и σ . На рис. 4 представлены зависимости T_{min} (σ) для трех значений f и R . Соответствующие годографы

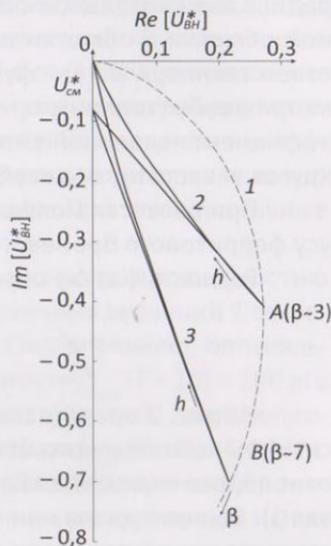


Рис. 3. Зависимость комплексного вносимого напряжения $\dot{U}_{вн}^*$ от контролируемого и влияющих параметров при измерении электропроводности

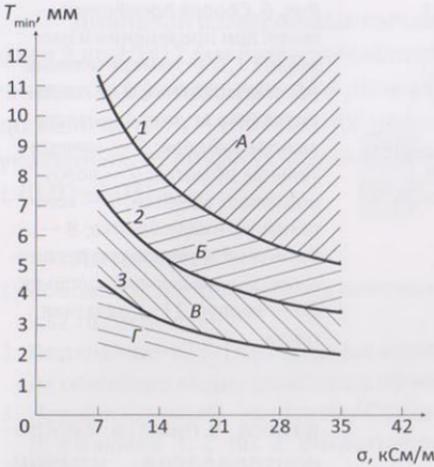


Рис. 4. Зависимость минимальной допустимой толщины изделия T_{\min} от измеряемой электропроводности (1 — $f = 0,8$ МГц, $R = 15$ мм; 2 — $f = 1,8$ МГц, $R = 10$ мм; 3 — $f = 5,0$ МГц, $R = 6$ мм)

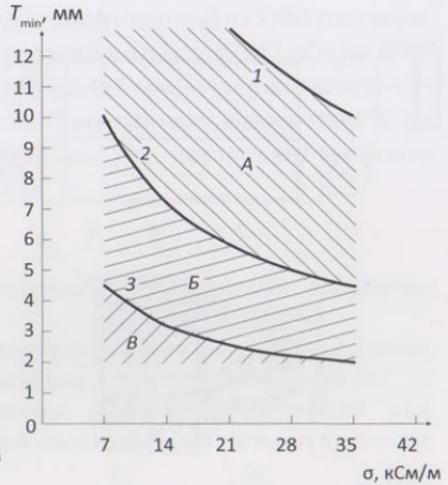


Рис. 5. Зависимость максимальной контролируемой толщины изделия T_{\max} от электропроводности основания (1 — $f = 35$ кГц, $R = 15$ мм; 2 — $f = 176$ кГц, $R = 10$ мм; 3 — $f = 875$ кГц, $R = 6$ мм)

комплексного относительного вносимого напряжения $\hat{U}_{\text{вн}}^*$ представлены на рис. 3. Измерение электропроводности в зоне А оптимально проводить преобразователем, у которого $f = 0,8$ МГц, $R = 15$ мм, в зоне Б — преобразователем, у которого $f = 1,8$ МГц, $R = 10$ мм, в зоне В — преобразователем, у которого $f = 5$ МГц, $R = 6$ мм. Измерение электропроводности в зоне Г можно производить вихретоковым частотным преобразователем, у которого $f \approx 12$ МГц, $R = 3$ мм, учитывая, что при его использовании не достигается подавление влияния h .

Следуя аналогичным рассуждениям, для измерения толщины изделия можно использовать три преобразователя. На рис. 5 представлены зависимости $T_{\max}(\sigma)$ для преобразователей, у которых годографы относительного вносимого напряжения $\hat{U}_{\text{вн}}^*$ соответствуют представленным на рис. 2. Параметры преобразователей и зоны измерения следующие:

- 1) $f = 35$ кГц, $R = 15$ мм (зона А);
- 2) $f = 176$ кГц, $R = 10$ мм (зона Б);
- 3) $f = 875$ кГц, $R = 6$ мм (зона В).

Градуировка преобразователей производится на эталонных образцах толщины и электропроводности, изготавливаемых по технологии производителя изделий. Семейство характеристик записы-

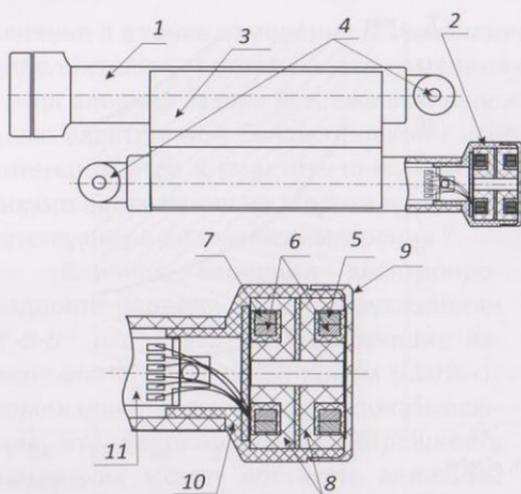


Рис. 6. Сборка преобразователей при проведении измерений: 1, 2 — измерительные преобразователи; 3 — соединительная втулка; 4 — места вывода кабелей; 5 — измерительная обмотка; 6 — возбуждающие обмотки; 7 — компенсационная обмотка; 8 — бронева ферритовые сердечники; 9 — защитный колпачок; 10 — корпус; 11 — печатная плата

Элементы электрической схемы, представленной на рис. 1, располагаются на печатной плате внутри преобразователей, что позволяет существенно уменьшить уровень наводок и собственных шумов и обеспечить требуемую чувствительность при измерениях. Связь с блоком обработки и представления информации осуществляется по каналу связи UART.

При измерениях требуемые преобразователи соединяются в единый блок с использованием соединительной втулки (рис. 6) и подключаются к блоку обработки и представления информации «Константа К6».

Перед началом измерений оператор задает границы диапазона T , затем с использованием одного из преобразователей оценивается величина электропроводности изделия, производится сборка необходимых для измерения преобразователей и их подключение к прибору. Прибор не требует проведения калибровки на образцах продукции перед началом контроля. Измерения могут осуществляться двумя способами:

- оператор производит измерение среднего значения электропроводности изделия по зоне контроля $\sigma_{\text{иср}}$ и далее производит измерения толщины изделия по заданной зоне, корректируя их с учетом $\sigma_{\text{иср}}$;
- оператор производит измерение электропроводности $\sigma_{\text{и1}}$ в каждой точке измерения и корректирует полученное в этой точке значение толщины с учетом $\sigma_{\text{и1}}$.

Диапазон измеряемых толщин стенок изделий из УКМ составляет от 2 до $10 \div 12$ мм при электропроводности от 7 до $35 \div 42$ кСм/м. Влияние зазора подавляется в диапазоне до 0,3 мм, а шероховатости — до величины $R_z \approx 150$ мкм. Абсолютная погрешность измерения T при указанных величинах мешающих параметров составляет не более $\pm (0,02 \div 0,03) T$.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бобович Б. Б. Полимерные композиционные материалы. URL: <http://www.ics2.ru/articles/>
2. Перепелкин К. Е. Полимерные композиты на основе химических волокон, их основные виды, свойства и применение. URL: <http://www.unctm.ru/>
3. Неразрушающий контроль/Справочник в 8 томах под общей ред. В. В. Клюева. Т. 2. Кн. 2: Вихретоковый контроль. — М.: Машиностроение, 2006. — 688 с.
4. Дорофеев А. Л., Никитин А. И., Рубин А. Л. Индукционная толщинометрия. — М.: Энергия, 1978. — 184 с.
5. Pauw L. J. van der. A method of measuring the resistivity and Hall coefficient on lamellae of arbitrary shape. — Philips Techn. Rev. 1958/59. V. 20. No. 8. P. 220–224.
6. Потапов А. И., Сясько В. А. Неразрушающие методы и средства контроля толщины покрытий и изделий. — СПб.: Гуманистика, 2009. — 904 с.